

$$\begin{aligned} W_{\mu\nu}(P, q) = & \frac{1}{2}(2\pi)^2 \int e^{iqx} \langle P | j_\mu \left( \frac{x}{2} \right) j_\nu \left( -\frac{x}{2} \right) | P \rangle d^4x = \\ = & (-g_{\mu\nu} + q_\mu q_\nu / q^2) F_1 + \left( \frac{P_\mu}{(Pq)} - \frac{q_\mu}{q^2} \right) \left( \frac{P_\nu}{(Pq)} - \frac{q_\nu}{q^2} \right) F_2 + \\ & + i \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} \frac{P_\alpha q_\beta}{2(Pq)} F_3. \end{aligned} \quad (*)$$

Здесь  $g_{\mu\nu}$  — метрический тензор,  $\mu, \nu = 0, 1, 2, 3$ ,  $F_{1,2,3}$  — С. ф., зависящие от  $Q^2 = -q^2$  (где  $q$  — некий 4-импульс), отношения  $x = Q^2/2(Pq)$  и квадрата массы адрона  $P^2$ ,  $\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}$  — абсолютно антисимметричный тензор (принята система единиц  $\hbar = c = 1$ ). При этом  $F_2$  и  $F_2 - xF_1$  определяют взаимодействие поперечно и продольно поляризованного виртуального  $\gamma$ -кванта, а  $F_3$  — корреляцию аксиального и векторного токов. Коррелятор  $(*)$ , а следовательно, и С. ф. входят в выражения для дифференциальных сечений рассеяния лептонов на адронах (см., напр., *Глубоко неупругие процессы*) в низшем порядке по константе эл.-магнитного (или слабого) взаимодействия.

В пределе упругого рассеяния, когда  $(P+q)^2 = P^2$  (в этом случае  $q$  — 4-вектор передачи импульса от лептона адрону), С. ф. выражаются через квадраты формфакторов адрона и быстро падают с ростом  $Q^2$ . Для глубоко неупругого рассеяния в пределе больших  $(P+q)^2, Q^2 \gg P^2$ , но фиксированном значении  $x$  (т. н. бъеркеновский предел) экспериментально установлено, что С. ф. слабо зависят от  $Q^2$ . В модели *партонов* С. ф. выражаются через распределение партонов в адроне по долям полного импульса адрона  $P$ . При этом роль доли импульса играет переменная  $x$ . Таким образом, С. ф. в этой модели не зависят от  $Q^2$ .

В ренормируемой квантовой теории поля зависимость С. ф. от  $Q^2$  связана с динамич. *аномальными размерностями* локальных операторов в *операторном разложении* произведения токов в выражении  $(*)$ . Это приводит к модификации партонной модели, к зависимости распределений партонов от квадрата передачи импульса  $Q^2$ , отходу от точечности партонов и возможности неупругого взаимодействия партонов с лептонами. Все эти эффекты (в т. ч. и *аномальные размерности*) вычисляются в теории возмущений *квантовой хромодинамики* с эф. зарядом  $\alpha_s(Q^2)$ .

*Лит. см.* при ст. *Глубоко неупругие процессы*. А. В. Ефремов.

**СТРУКТУРНАЯ ФУНКЦИЯ** случайного процесса  $\{\xi_t, t \in T\}$  ( $T \subseteq R^1$  — некий конечный или бесконечный интервал) — корреляция  $D(\tau_1, \tau_2)$  его приращений  $\Delta_{\tau_1}\xi$  и  $\Delta_{\tau_2}\xi$  на двух промежутках времени  $\tau_1 = (t_1, t'_1)$ ,  $\tau_2 = (t_2, t'_2) \subseteq T$ ,  $t_i < t'_i$ ,  $i = 1, 2$ , где  $\Delta_{\tau_i}\xi = \xi_{t'_i} - \xi_{t_i}$ .

Таким образом,

$$\begin{aligned} D(\tau_1, \tau_2) = & \langle (\Delta_{\tau_1}\xi - \langle \Delta_{\tau_1}\xi \rangle)(\Delta_{\tau_2}\xi - \langle \Delta_{\tau_2}\xi \rangle) \rangle = \\ = & \langle \Delta_{\tau_1}\xi \cdot \Delta_{\tau_2}\xi \rangle - \langle \Delta_{\tau_1}\xi \rangle \cdot \langle \Delta_{\tau_2}\xi \rangle, \end{aligned}$$

где  $\langle \dots \rangle$  означает среднее по распределению вероятностей процесса  $\xi_t$ .

Иногда С. ф. называют только дисперсию  $D(t)$  приращений  $\Delta_t\xi$ :

$$D(t) \equiv D(t, t) = \langle (\Delta_t\xi - \langle \Delta_t\xi \rangle)^2 \rangle$$

[по ф-ции  $D(t)$  можно восстановить и полную С. ф.  $D(\tau_1, \tau_2)$ ; см., напр., лит-ру].

В случае *случайного процесса со стационарными приращениями*  $\{\xi_t, t \in R^1\}$  его С. ф.  $D(\tau_1, \tau_2)$  не меняется при любом «сдвиге» промежутков  $\tau_1, \tau_2$ :

$$\tau_i \rightarrow \tau_i + s = (t_i + s, t'_i + s), i = 1, 2; s \in R^1.$$

*Лит.*: Гихман И. И., Скороход А. В., *Введение в теорию случайных процессов*, М., 1965. Р. А. Минлос.

**СТРУКТУРНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ** (конфигурационные фазовые переходы, полиморфные превращения) — фазовые переходы в кристаллич. твёрдых телах, состоящие в перестройке структуры этих тел за счёт изменения взаимного расположения отдельных атомов, ионов или их групп и приводящие обычно к изменению типа симметрии кри-

сталла. С. ф. п. могут происходить при изменении одного или неск. термодинамич. параметров — темп-ры  $T$ , давления  $p$ , концентрации компонент (в случае сплава или твёрдого раствора) и др. Наиб. изучены С. ф. п. по темп-ре. Как правило, при понижении  $T$  до  $T_k$  происходят С. ф. п. из кристаллич. структуры с более высокой симметрией в кристаллич. структуру с более низкой симметрией. При этом исходная и конечная кристаллич. модификации (фазы) могут резко отличаться по свойствам (см. *Полиморфизм*). С. ф. п. обычно сопровождаются изменением свойств твёрдого тела — упругих, электрических, магнитных и т. п. (см. *Сегнетоэлектрики*, *Сегнетоэлектистики* [2, 3]).

Если изменяется только точечная симметрия кристалла, то С. ф. п. наз. собственными, если изменяется трансляционная симметрия, — несобственными. Последние приводят к возникновению *сверхструктур*, как соизмеримых, так и несоизмеримых, а также *доменов* (ориентационных и трансляционных).

Для определения возможных для данной исходной структуры путей (каналов) перехода в др. структуры используется метод, основанный на теоретико-групповой классификации кристаллич. фаз [1].

Многие С. ф. п. сопровождаются изменением фононного спектра — появлением в нём т. н. мягкой моды, свидетельствующей о неустойчивости данной кристаллич. структуры; одна из оптич. ветвей спектра «смягчается», т. е. щель в ней резко уменьшается, а затухание колебаний резко растёт с приближением  $T$  к  $T_k$  (см. *Колебания кристаллической решётки*).

Характерным для С. ф. п. является также появление в фононном спектре т. н. центрального пика — низкочастотной релаксац. моды малой ширины (по частоте) и высокой интенсивности, связанной с движением доменных стенок вблизи темп-ры перехода  $T_k$ .

**Экспериментальные методы.** Экспериментально С. ф. п. идентифицируются с помощью дифракц. методов — *рентгеновского структурного анализа* и *нейтронографии структурной* (по изменениям межатомных расстояний и объёма элементарной ячейки), по особенностям в поведении теплоёмкости  $C(T)$  при  $T = T_k$ , а также по изменению скорости звука и упругих модулей решётки. Используются также резонансные методы, основанные на появлении мягкой моды в центре пика, к-рые детектируются с помощью комбинационного рассеяния света, *Мандельштама* — *Брэдлюэна рассеяния*, а также неупругого рассеяния нейтронов. Для С. ф. п. с участием магнитоактивных ионов применяются также электронный парамагн. резонанс (ЭПР), ядерный магн. резонанс (ЯМР), мёссбауэровская спектроскопия.

**Изменение параметра порядка.** Как и любые фазовые переходы, С. ф. п. сопровождаются изменением параметра порядка, к-рый характеризует координат. упорядочение в конденсиров. среде (см. *Дальний и ближний порядок*). Макроскопич. параметром порядка при описании С. ф. п. может служить изменение локальной плотности кристалла  $\delta\rho(r) = \rho_2(r) - \rho_1(r)$  [индексы 1 и 2 соответствуют исходной и конечной фазам; точнее, следует говорить о наборе коэф. разложения  $\delta\rho(r)$  по неприводимым представлениям исходной группы симметрии кристалла  $G$ ]. При микроскопич. описании параметр порядка строится на векторах смещений атомов относительно их ср. положений (узлов кристаллич. решётки) в исходной фазе.

Среди всех возможных С. ф. п. различают С. ф. п. 2-го рода (типа смещения), при к-рых параметр порядка изменяется плавно и непрерывно, обращаясь в нуль при  $T = T_k$ , и С. ф. п. 1-го рода (типа порядок — беспорядок), когда параметр порядка испытывает скачок при  $T = T_k$ . С. ф. п. типа смещения более характерны для простых веществ, тогда как С. ф. п. типа порядок — беспорядок — для бинарных сплавов и твёрдых растворов. Примером С. ф. п. 2-го рода является упорядочение в  $\beta$ -латунь  $\text{CuZn}$  с ОЦК-структурой или в двухкомпонентных сплавах типа  $AB$  ( $\text{AuCu}$ ,  $\text{CoPt}$ ,  $\text{FePd}$  и др. с ГЦК-структурой). Во всех этих веществах выше  $T_k$  заполнение всех узлов решётки